

## Mikroskope



Mess- und Inspektionsmikroskope mit unterschiedlicher Ausstattung für Halbleiter / MEMS Applikationen. Sie zeichnen sich insbesondere durch höchste optische Leistungsfähigkeit und eine schnelle und einfache Bedienung aus.

[Mehr Informationen](#)

## Inspektion & Metrologie

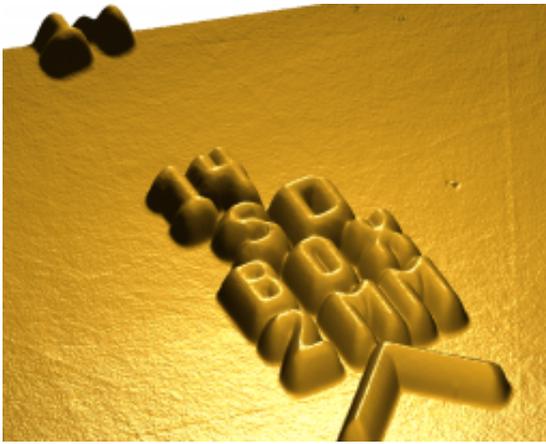


**PROMIS** - Promicron Inspektions- & Metrologie-Systeme

- Vollautomatisch
- Flexibel nutzbar
- Für Inspektion und Metrologie

[Mehr Informationen](#)

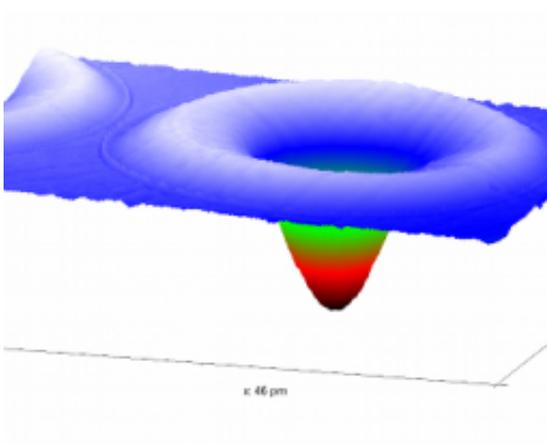
## Weißlichtinterferenz



**PRO-WLI** - Mikroskopausrüstung auf Basis von INM200/Ergoplan oder DM8000 mit Interferometer-Hardware & Software zur Vermessung der Topografie sowie zum Export der 3D Daten.

[Mehr Informationen](#)

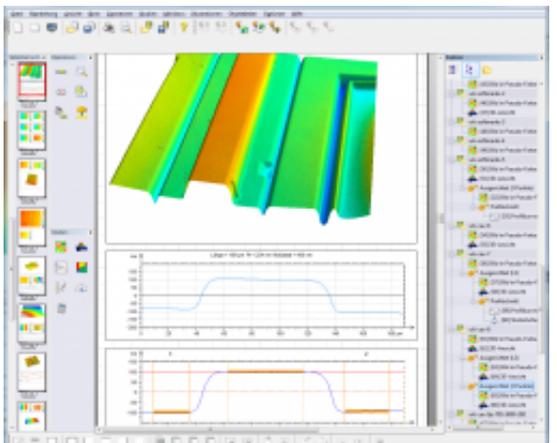
### **Konfokalmikroskopie**



**PRO-CON** - Mikroskop-Konfokalmodul als Upgrade für hochauflösende 3D Metrologie.

[Mehr Informationen](#)

**Software MCS**

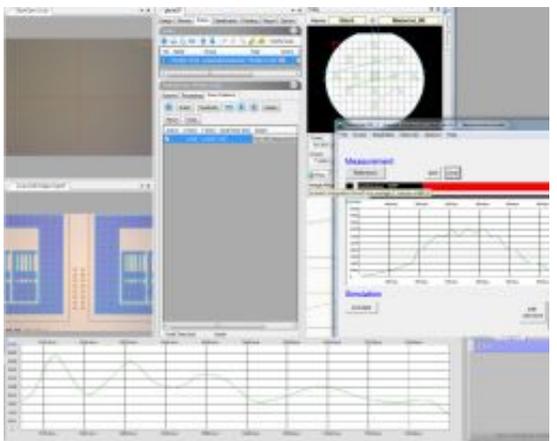


Modulare Softwaresuite MCS:

- Inspektion
- Review
- Messtechnik (CD, Konfokal,...)
- Hardwaresteuerung

[Mehr Informationen](#)

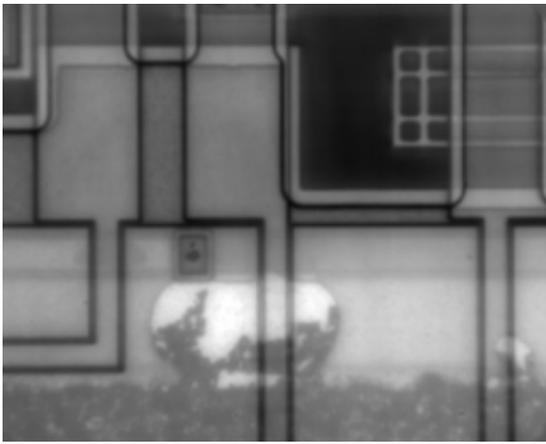
## Schichtdickenmessung



Optische Schichtdickenmessung (Thin Film Measuring) mittels NanoCalc.

[Mehr Informationen](#)

## Infrarotsysteme



Leistungsfähige Infrarot- und VIS-Systeme.

[Mehr Informationen](#)